3-5 反射箱による無線機の放射電力測定

3-5 Total Radiated Power of Radio Transmitters Measured in a Reverberation Chamber

張間勝茂 杉山 功 山中幸雄 篠塚 隆 HARIMA Katsushige, SUGIYAMA Tsutomu, YAMANAKA Yukio, and SHINOZUKA Takashi

要旨

反射箱は、攪拌機の機械的な移動により境界条件を変化させて、ランダムな電磁界分布を発生させ る。理想的な反射箱を仮定すると、電界の変動分布はレイリー分布に従い、空間的な電界分布は統計 的に均一である。供試機からの直接波の影響を避けるように受信アンテナを配置すれば、全放射電力 は、変動分布の平均値や中央値から統計的に求めることができる。しかしながら、実際の反射箱では、 反射箱内の電界分布の均一性は、反射箱の大きさや攪拌機の構造等により影響を受ける。また、広帯 域放射源の電力測定には、長時間を要する問題がある。本論文では、反射箱内の電界分布の統計的な 特性について、理論及び実験的に評価した結果を述べるとともに、我々が提案している広帯域放射源 の全放射電力の効率的な測定手法及び直接波の影響を低減できる累積分布の 63.2%値を用いた統計的 手法について紹介する。

A random electromagnetic field is created in a reverberation chamber by moving mechanical stirrers to vary the boundary condition. The received E-field strength caused by moving the stirrer is Rayleigh distributed and the field distribution is statistically uniform in an ideal reverberation chamber. The total radiated power of the EUT is obtained by the substitution method from the average or median value of the E-field when the receiving antenna is placed so as to avoid the influence of the direct wave from the EUT. However, using the substitution method requires a great deal of time to measure the averaged received level for a broadband radiated source. The dimensions of the chamber and the structure of the stirrers affect the field uniformity in an actual chamber. The statistical characteristics of the spatial E-field distribution in a reverberation chamber are described, along with an efficient technique for measuring total radiated power of broadband radiated sources and the statistical technique using a 63.2% value of the cumulative distribution that can reduce the influence of the direct wave.

[キーワード] 反射箱, 全放射電力, レイリー分布, ライス分布, マルチパス, 攪拌機 Reverberation chamber, Total radiated power, Rayleigh distribution, Rice distribution, Multi path, Stirrer

1 まえがき

反射箱は、金属箱の内部に設置した攪拌機によ り境界条件を変化させ、統計的に均一な電界分布 を発生させる装置であり^[1]、放射エミッションや 放射イミュニティ測定などの EMC 測定に用いら れている^{[2][3]}。また、アンテナー体型無線機の放 射電力測定にも有効な方法である。

反射箱による放射電力の測定では、供試機器 (EUT)を反射箱の試験領域内に配置し、攪拌機の 移動により得られた受信電力の変動分布の平均 値、中央値又は最大値から全放射電力を推定する。 このとき、受信電力に含まれる EUT からの直接 波成分が測定誤差の要因となる。また、理想的な



─ 特集 ● EMC 特集

反射箱を仮定すると電界分布の均一性は、確率密 度関数から理論的に求めることができるが[4][6]、 実際の反射箱では、その大きさや攪拌機の構造等 の影響を受ける[5][6]。

一方、不要発射に対する規制に基づくスプリア ス測定や、超短パルス波を利用した無線システム である Ultra Wide Band (UWB)の放射電力測定な ど広帯域の測定が必要となるが、従来の測定法で は長時間を要する欠点がある。

本文では、反射箱内の空間的な電界分布の均一 性について、理論値と実測値の比較結果60を示し、 次に、広帯域放射源の放射電力を短時間で測定で きる改良連続回転法^[7][8]及び直接波の影響を低減 できる測定法である受信電力の累積確率(CDF) 63.2%値を用いた統計的手法^[9]をそれぞれ紹介 する。

2 電界分布の統計的特性

2.1 確率密度関数

反射箱内の電界は、攪拌機の移動による境界条 件の変化に応じて大きく変動する。反射箱の大き さが波長に対して大きく、反射箱内に十分な共振 モード数があれば、反射箱内のある位置での電界 は、攪拌機の移動によりランダムな位相を持つマ ルチパス波の合成和となる。

一般に、矩形の金属筐体内に発生する全共振モ ード数(n)は、Weylの式により

$$n \cong \frac{8\pi abc}{3\lambda^3} \tag{1}$$

と近似できる^[1]。ここで、*a*, *b* 及び *c* は筐体の 三辺の長さ、λは波長である。

反射箱内のある位置での電界ベクトル E は、 実数項と虚数項からなる直交3成分、すなわち6



個のパラメータ、で次式のように表すことができ る。

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_{x} + \boldsymbol{E}_{y} + \boldsymbol{E}_{z} \tag{2}$$

 $E_{x,y,z} = \text{Re}(E_{x,y,z}) + i \text{Im}(E_{x,y,z})$ (3)

攪拌機の移動に伴い非常に多くのマルチパス波が生じるので、電界の直交成分の実数項及び虚数 項成分は中心極限定理により、正規分布に近づく。 また、これら実数項と虚数項の間に相関はないの で、各成分は独立な確率変数である。反射箱が理 想的であると仮定すると、直交成分の実数項と虚 数項の平均及び2乗平均は

$$\left\langle \operatorname{Re}\left(\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right)\right\rangle = \left\langle \operatorname{Im}\left(\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right)\right\rangle = 0$$
 (4)

$$\left\langle \operatorname{Re}\left(\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right)^{2}\right\rangle = \left\langle \operatorname{Im}\left(\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right)^{2}\right\rangle$$

= $E_{0}^{2}/6 \equiv \sigma^{2}$ (5)

となる^[10]。ここで、E₀²は電界 *E* の大きさの 2 乗平均、σ²は分散である。

したがって、電界の6個のパラメータは互いに 独立な確率変数で、それぞれが、平均0、分散 σ^2 の正規分布であるから、それらの各電界成分の2 乗和、すなわち電界ベクトルの大きさの2乗は、 自由度6のカイ2乗(χ^2)分布となる。また、電 界ベクトルの大きさは、自由度6のカイ分布(χ^2 分布の平方根分布)となる。これらの分布の確率 密度関数はそれぞれ

$$f\left(\left|\boldsymbol{E}\right|^{2}\right) = \frac{\left|\boldsymbol{E}\right|^{4}}{16\,\sigma^{6}}\exp\left(-\frac{\left|\boldsymbol{E}\right|^{2}}{2\,\sigma^{2}}\right) \tag{6}$$

$$f\left(\left|\boldsymbol{E}\right|\right) = \frac{\left|\boldsymbol{E}\right|^{5}}{8\sigma^{6}} \exp\left(-\frac{\left|\boldsymbol{E}\right|^{2}}{2\sigma^{2}}\right)$$
(7)

である[10][11]。

一般に、電界の測定に直線偏波のアンテナが用 いられるため、測定される電界は2個のパラメー タからなる1方向の直交成分の大きさである。し たがって、受信電界の変動は自由度2の2分布に 従い、その確率密度関数及び累積分布関数はそれ ぞれ

$$f\left(\left|\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right|\right) = \frac{\left|\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right|}{\sigma^{2}} \exp\left(-\frac{\left|\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right|^{2}}{2\sigma^{2}}\right) \qquad (8)$$

$$F\left(\left|\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right|\right) = 1 - \exp\left(-\frac{\left|\boldsymbol{E}_{x,y,z}\right|^{2}}{2\sigma^{2}}\right)$$
(9)

である[10][11]。これら分布の特性はレイリー分布 と同じである。

2.2 空間的均一性

反射箱内の空間的な電界分布の均一性は、攪拌 機のステップ数に影響される。ステップ数は、攪 拌機の位置の変化の総数である。

反射箱が理想的であると仮定すると、攪拌機の 移動に伴うある測定点での電界の大きさの変動 は、レイリー分布に従うことを前章で示した。攪 拌機を固定(N=1)して測定点を移動したときの 電界の大きさの変動、すなわち空間的な電界の分 布も同様にレイリー分布に従う。

ステップ数 N で得られる電界変動の空間的な 平均値分布及び最大値分布を、レイリー分布に従 う母集団から N 個のデータをランダム・サンプ リングすることにより求めた。図 2 にステップ数 に対する各分布の確率密度関数 (PDF) の計算結果 をそれぞれ示す。

また、最大値分布の確率密度関数は、極値理論 を適用して推定することができる[12]。すなわち、 確率変数 $x \in N$ 回独立にサンプルしたとき、そ の最大値 x(N)を確率変数とすると、極値理論に よりその変数の累積分布関数 $F_N(x)$ 及び確率密 度関数 $f_N(x)$ は

$$F_N(x) = F(x)^N \tag{10}$$

$$f_N(x) = N \cdot F(x)^{N-1} \cdot f(x) \tag{11}$$

で表すことができる。

図 2 (b) に、(8)、(9) 及び (11) 式により求めた 最大値の確率密度関数の計算結果を示す。極値理 論及びランダム・サンプリングにより求めた理論 値は一致している。

電界の均一性を、図2に示した各分布の確率密 度関数を用いて求めた。図3にステップ数に対す る平均値、中央値及び最大値分布の標準偏差を示 す。各分布の均一性はステップ数の増加により改 善していくが、ある程度以上にステップ数を多く してもその効果は少ない。また、平均値及び中央 値分布は最大値分布に比べ均一性の収束が良い。 例えば、平均値、中央値及び最大値分布の標準偏 差が 1dB 以下になるために必要な攪拌機のステ ップ数は、それぞれ 19、34 及び 92 である。

以上述べたように理想的な反射箱を仮定すれ ば、電界分布の均一性はその分布の確率密度関数 から攪拌機のステップ数の関数として表すことが できる。しかしながら、実際の反射箱では、均一 性は測定周波数や攪拌機の構造等により影響を受 ける。これらの均一性に対する影響について、理



NiCT 61





図4 反射箱

論値と実測値の比較を行った。

図4に測定に用いた大きさ、攪拌機の構造及び 設置数の異なる二つの反射箱を示す。これらの反 射箱内に1m×1m×1mの測定領域を設定し、 25 cm 間隔の5×5×5の格子で区切った125の 測定点で、200 MHzから3 GHz について電界分 布を測定した。

図5に平均値分布の実測値と理論値の均一性の 比較を示す。均一性は、反射箱の大きさが波長に 対して十分大きければ、すなわち、共振モード数 が十分多く存在するような大きさであれば、理論 値に近づく。また、低い周波数帯では共振モード 数が少なくなり均一性が悪くなることが分かる。 さらに、攪拌機の構造によって均一性が影響され ることを示している。

3 放射電力測定法

本章では、反射箱を用いた放射電力測定法とし て検討を行った二つの測定法を示す。3.1 で広 帯域放射源の放射電力の効率的な測定手法を、 3.2 で直接波の影響を低減できる統計的手法を それぞれ紹介する。

3.1 改良連続回転法

反射箱を用いた放射電力の標準測定法には、 "mode-stirred method"(連続回転法)及び"modetuned method"(ステップ回転法)の二つの方法が ある^[2]。



連続回転法では、攪拌機を連続的に回転しなが ら、測定周波数ごとに回転1周期間の受信レベル の変動を測定するため、広帯域の受信電力測定に 長時間を要する。また、ステップ回転法では、攪 拌機をステップ状に回転させ、各攪拌機の位置ご とに受信レベルを測定する。広帯域の測定には、 有効な方法であるが、攪拌機のステップ数を多く とる必要があり、攪拌機の駆動系の制御が容易で はない。このため広帯域放射源の放射電力を短時 間(数分内)で測定できる改良法を提案し、この方 法の有効性を実験により確認した[7][8]。

図 6 に示すように反射箱内に送・受信アンテナ を配置し、送信アンテナに入力電力 $P_{in}(f)$ を加 える。攪拌機を連続的に回転させながら 1 周期間、 受信アンテナの受信電力 $P_r(f)$ 及び送信アンテ ナからの反射電力 $P_{ref}(f)$ を測定し、次式により 送信アンテナへの入力電力 $P_{net}(f)$ を求める。

$$P_{net}(f) = P_{in}(f) - P_{ref}(f)$$
(12)

次に、受信アンテナと同じ位置に EUT を配置 し同様に攪拌機を回転させながら受信電力 $P_{eut}(f)$ を測定する。下記により EUT の全放射電力 $P_{Total}(f)$ を求めることができる。

$$P_{Total}(f) = P_{eut}(f) \cdot \frac{P_{net}(f)}{P_r(f)}$$
(13)

このとき、スペクトラムアナライザの周波数ス パンをできるだけ広く設定し、攪拌機の回転の1 周期間に多くのサンプル数が得られるように、ス ペクトラムアナライザの掃引速度を攪拌機の回転 速度に比べて十分に高速に設定する。攪拌機の1 周期(1回転)間の受信電力を真値で平均化する。 このとき、スペクトラムアナライザの検波モード はサンプルモードである。



3.1.1 実験結果と考察

反射箱を用い改良連続回転法により放射電力を 測定した。ダブルリッジドガイドホーンアンテナ を送・受信アンテナとして用い、スペクトラムア ナライザと接続した。送信アンテナは、直接波の 影響を避けるために受信アンテナを直接照射しな いように配置した。EUT として、パルス波(パル ス幅 84 ps、パルス周期 10 ns)を発生するコムジ ェネレータを用いた。このコムジェネレータには、 ダブルリッジドガイドアンテナが取り付けてあ る。

三つの攪拌機を異なる速度(1, 2, 3 rpm)で回 転させながら、1 GHz から 18 GHz について放射 電力を測定した。スペクトラムアナライザをサン プルモードで、4 GHz の周波数帯域(20001 ポイ ント)を 390 ms で掃引し、攪拌機の回転 1 周期 間に 120 回の平均受信電力を求めた。

図7にコムジェネレータのパルス波の出力波形 と反射箱内での受信波形を示す。このような短パ ルス波では、反射箱の高いQのためパルス波形 がゆがむことを示している。したがって、通常行 われるCW波を用いた置換では、放射電力の推 定結果にこの波形歪による影響が予想される。こ のため、EUTの送信パルス波と同様なパルス波 による置換を行いCW波による結果と比較した。

図8にコムジェネレータの放射電力測定結果を 示す。改良連続回転法と従来のステップ回転法に よる結果はよく一致しており、改良法の有効性が 確認できた。また、このときの測定時間は5分で あり、改良法の適用により短時間測定が可能にな る。しかし、このような短パルス波に対するCW 波置換による結果は、コムジェネレータの出力レ ベルより、3 dB から5 dB 程度大きくシフトした。 一方、パルス波を用いた置換結果はこのような差 異が見られなかった。この結果は、短パルス波の 放射電力測定には、EUT の送信波形と同様なパ ルス波による置換が有効であることを示してい る。

3.2 統計的推定法

3.2.1 推定法の原理

反射箱内に無線機と受信アンテナを配置したと き、受信アンテナには無線機からの直接波と攪拌 機の回転により生じたランダムな位相を持つ反射







波が到来する。この直接波とマルチパス波の合成 波の受信電力 r の確率密度関数 (PDF) p(r) は次 式で表され、その分布は Rice 分布に従う^[13]。

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(A\frac{r}{\sigma^2}\right)$$
(14)

ここで σ^2 はマルチパス波の電力、 $A^2/2$ は直接 波の電力、 I_0 は0次の変形ベッセル関数である。

直接波の電力とマルチパス波の電力の比をρと 定義し、rを直接波とマルチパス波の電力和の平 方根で規格化すると(14)式は

$$p(R) = 2(1+\rho)R \cdot \exp\left\{-\left[\rho + (1+\rho)R^{2}\right]\right\}.$$
$$I_{0}\left[2R\sqrt{\rho(1+\rho)}\right]$$
(15)
と書ける。ここで、

$$\rho = \frac{A^2 / 2}{\sigma^2} \tag{16}$$

$$R = \frac{r/\sqrt{2}}{\sqrt{A^2/2 + \sigma^2}}$$
(17)

である。

式 (15) を R で積分することにより求められる 累積分布関数 (CDF) F (R) を図 9 に示す。 $\rho \rightarrow \infty$ のときは F (R) = U (R-1)、ここで U はステップ 関数、となり、 $\rho = 0$ のときは、F (R) = 1-exp (-R²) となり、Rayleigh 分布と同じ特性を持つ。 これらの曲線は CDF の R=1、すなわち、0.632 (=F(1)) において交差する。両者の間の任意の ρ に対しては交差点はずれるが、CDF の 63.2% 値に対して、そのずれは 0.5 dB 以内であること



図9 Rice 分布の累積分布関数



が分かる (図 9 参照)。すなわち規格化包絡線の CDF の 63.2%値は p にかかわらずほぼ一定の値 になる。

図 10 のように反射箱内に送信アンテナ T、受 信アンテナ R を置いたとき、送信アンテナに供 給される電力を P_F 、送信アンテナの反射係数を Γ_T としたとき放射電力 P_T は式 (18) となる。

$$P_T = P_F \cdot \left(1 - \left|\Gamma_T\right|^2\right) \tag{18}$$

また、このときの受信信号の CDF の 63.2%値 を *P*_{TR63}とすると、反射箱損 *Lc* は式 (19) のよう に定義できる。

$$L_C = \frac{P_T}{P_{TR63}} \tag{19}$$

ここで、送信アンテナ T を無線機 (EUT) と入 れ替える。EUT の放射電力を *PEUT* とし、このと きの受信信号の CDF の 63.2%値を *PEUTR63* とす ると、式 (20) のようになる。

$$\frac{P_{EUT}}{P_{T}} = \frac{P_{EUTR63}}{P_{TR63}}$$
(20)
$$U \hbar \hbar^{3} \circ \tau,$$

$$P_{EUT} = P_{EUTR63} \cdot L_C \tag{21}$$

により反射箱損 Lcと EUT の受信信号の CDF の 63.2%値から EUT の放射電力を求めること ができる。この手法を用いることにより直接波が 存在するような条件でも精度良い測定が可能とな る^[9]。

3.2.2 2.45 GHz 無線機の放射電力測定例

置換法により無線機の放射電力を測定する場 合、反射箱が理想的であれば、置換用アンテナは どこにおいても良い。しかしながら、実際の反射 箱では電界分布の均一性は、周波数や攪拌機の構 造によって影響されるので、反射箱損は送信アン テナの位置により異なる。例えば、ノートパソコ ンに内蔵された無線 LAN 機器のように放射源が 未知な EUT の場合、置換用アンテナの配置位置 によって測定値が異なる可能性がある。このため、 配置位置による影響を 2.45 GHz 信号発生器を内 蔵したノートパソコン (ダミーノート PC) を用い て検討した。ダミーノート PC は、ノートパソコ ン筐体内部のマザーボード等を取り除いて 2.45 GHz の送信機を内蔵し、PCMCIA 無線 LAN カ ードのアンテナを送信アンテナとして使用してい る。

ダミーノート PC の放射電力を水平方向に 90 度おきに回転した 4 方向についてそれぞれ置換用 アンテナの位置を変えて受信信号の CDF の 63.2%値により推定した^[14]。このとき、反射箱 損は、カードアンテナ近傍の 5 点の平均、PC 筐 体中心近傍の 6 点の平均とした。

測定結果を図 12 に示す。なお、真値はアンテ ナ入力端に電力計を直結して測定した値と、反射 箱内でのアンテナ反射係数の測定値 (変動幅 0.3 dB) から補正して求めた。

置換位置を PC 筐体中心近傍とした時 (○印) は 真値と比べ最大 1.5 dB、カードアンテナ位置近傍 で置換した時 (◇印) は最大で 0.5 dB の差異がそ れぞれ生じた。しかし、4 方向で測定した放射電 力の平均値では、PC 筐体中心近傍で置換した時 には 0.6 dB の差異、カードアンテナ位置近傍で 置換した時には真値と一致した。







4 まとめ

反射箱内の電界分布の統計的特性について、実 験及び理論的に検討し、均一性に対する周波数及 び攪拌機による影響を示した。

広帯域放射源の全放射電力測定法として、改良 連続回転法を提案し、この方法の有効性を確認し た。また、短パルス波の放射電力測定に対しては、 連続波による置換では誤差が生じること及び送信 波形と同様なパルス波による置換の有効性を実験 により示した。

さらに、直接波の影響を低減できる放射電力測 定法として累積分布の 63.2%値を用いる統計的 手法を提案した。この方法による 2.45 GHz 無線 機の測定結果を示し、EUT の放射源と置換用ア ンテナの位置を正確に合わせること、あるいは、 放射源近傍の平均値を用いることで高い精度で放 射電力を推定することが可能であることを示し た。

今後は、パルス幅による影響の評価、スプリア ス測定及び床置型機器のような大きな EUT に対 する放射電力測定法の検討が必要である。

謝辞

統計的推定法の検証に当たり、ダミーノート PC(2.45 GHz 無線機)を快くお貸し頂いた、 財団法人テレコムエンジニアリングセンターの 中島恭一氏、野島友幸氏に深く感謝したします。

参考文献

- M.L.Crawford and G.H.Koepke, "Design, evaluation, and use of a reverberation chamber for performing electromagnetic susceptibility/vulnerability measurements", National Bureau of Standards Technical Note 1092, Apr. 1986.
- **2** IEC 61000-4-21, "Testing and measurement techniques reverberation chamber test methods", 2003.
- 3 CISPR Publication 16-1, "Reverberation chamber for total radiated power measurement", 1996.
- **4** M.O.Hatfield, "A calibration procedure for reverberation chambers", Proc. 2000 IEEE International Symposium on EMC, pp.621-626, Washington D. C., USA, Aug. 2000.
- 5 K.Harima and Y.Yamanaka, "Evaluation of electric-field uniformity in a reverberation chamber for radiated immunity testing", IEICE Trans. Commun., Vol.E84-B, No.9, pp.2618-2621, Sep. 2001.



- **6** K.Harima, "Statistical Characteristics of E-Field Distribution in a Reverberation Chamber", IEICE Trans. Commun, Vol.E88-B, No.8, pp.3127-3132, Aug. 2005.
- 7 K.Harima and Y.Yamanaka, "Determining Total Radiated Power for Short Pulse Signals by Using a Reverberation Chamber", Proc. EMC Europe Workshop 2005, pp. 77-79, Rome, Italy, Sep. 2005.
- 8 K.Harima, "Radiated Emission Measurement of Small EUT by Using a Reverberation Chamber", Proc. 2003 IEEE EMC Symposium, pp.471-474, Istanbul, TURKEY, May 2003.
- **9** T.Sugiyama, T.Shinozuka, and K.Iwasaki, "Estimation of Radiated Power of Radio Transmitters Using a Reverberation Chamber", IEICE Trans. Commun., Vol.E88-B, No.8, pp.3158-3163, Aug. 2005.
- 10 G.Kostas and B.Boverie, "Statistical model for a mode-stirred chamber", IEEE Trans. Electromagn. Compat., Vol.33, No.4, pp.366-370, Nov. 1991.
- 11 D.A.Hill, "Plane wave integral representation for fields in reverberation chambers", IEEE Trans. Electromagn. Compat., Vol.40, No.3, pp.209-217, Aug. 1998.
- 12 T.H.Lehman and G.J.Freyer, "Characterization of the maximum test level in a reverberation chamber", Proc. 1997 IEEE International Symposium on EMC, pp.44-47, Austin, USA, Aug. 1997.
- 13 S.O.Rice, "Statistical properties of a sine wave plus random noise", Bell Syst. Tech. J., Vol.27, pp.109-157, Jan. 1948.
- 14 M.Uchino, O.Tagiri, and T.Shinozuka, "Real-Time Measurement of Noise Statistics", IEEE Trans. Electromagn. Compat., Vol.43, No.4, pp.629-636, Nov. 2001.

はりま かつしげ

無線通信部門EMC計測グループ主任 研究員 EMC測定



杉山 访

無線通信部門 EMC 計測グループ研究 員 EMC 測定





後後不足 無線通信部門研究主管 環境電磁工学

